

[首页](#)[机构](#)[成果](#)[学者](#)

# 中国科学院机构知识库网格

Chinese Academy of Sciences Institutional Repositories Grid

[登录](#) [注册](#)

CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

## 薄膜材料电/热/力藕合作下性能测试系统及测试方法

文献类型: 专利

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览

111

下载

0

收藏

0

**作者** 张广平,张滨,于庆源**发表日期** 2010-12-01**专利国别** 中国**权利人** 中国科学院金属研究所**公开日期** 2013-06-19**语种** 中文**专利申请号** 200610047538.3**源URL** [<http://210.72.142.130/handle/321006/68268>] **专题** 金属研究所\_中国科学院金属研究所**推荐引用方式** 张广平,张滨,于庆源. 薄膜材料电/热/力藕合作下性能测试系统及测试方法. 2010-12-01.**GB/T 7714**[其他版本](#)

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

[» 欧盟学术资源开放存取平台](#) | [» CALIS高校机构知识库](#) | [» 台湾学术机构典藏](#) | [» 香港机构知识库整合系统](#) | [网站地图](#) | [意见反馈](#)

□ 版权所有 ©2023 中国科学院 - 运行维护: 中国科学院兰州文献情报中心/中国科学院西北生态环境资源研究院 - Powered by CSpace



0931-8270076 发送邮件

陇ICP备2021001824号-8



甘公网安备 62010202001088号